

討17

ブリキの塗料密着性におよぼす不働態皮膜の影響

日本鋼管 技研福山 高野 宏

○渡辺豊文

I 緒 言

電気メッキブリキはメッキ、あるいはメッキ層を溶融した後、 $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 水溶液中でクロメート処理（浸漬あるいは陰極電解）が施され、不働態皮膜を形成している。不働態皮膜はブリキの表面特性に大きな影響を与えている。最近、ブリキの用途として塗装缶が増し、表面特性の中で塗装性が重要視されているので、特に塗料密着性におよぼす不働態皮膜の影響について検討を行なった。

II 実験方 法

- (1)供試材：板厚0.32mmのブリキ用原板をフェロスタン浴で電気メッキ(025% B.B.)を施し、さらにメッキ層を溶融した後、ただちに2% $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 水溶液中でクロメート処理（以下A法と呼ぶ）を施すかあるいは3% NaHCO_3 水溶液中で陰極電解(5A/dm², 1秒)を行なった後、上記の液中でクロメート処理（以下B法と呼ぶ）を施すか、あるいは $\text{CrO}_3\text{-NaSCN-ArF}_3\text{-3NaF}$ 系の水溶液中で陰極電解処理（以下C法と呼ぶ）を施したブリキを使用した。その他、クロメート処理を施さないブリキも使用した。
- (2)塗料密着性試験：関西ペイント製 SJ-6256（エポキシフェノール系塗料、乾燥重量50mg/dm²）をブリキに塗布し、205°Cで10分焼付けを行ない室温で24時間放置した後、5mm（ライン方向）×100mmに剪断した2枚の試験片を線状ポリアミド系のフィルムで接着（200°Cで加熱圧着）を行ない室温で24時間放置する。試験片は引張試験機（東洋ボールドウィン製UTM-III-100）を使用し、引張速度200mm/minでTピール試験を行ない、その剥離強度で塗料密着性を評価した。
- (3)電子顕微鏡観察：水銀アマルガム法に従って試料作成を行ない、透過電子顕微鏡を使用し観察した。
- (4)陽極および陰極分極曲線の測定：クロム層の測定はPH7.4の緩衝液($\text{Na}_2\text{HPO}_4\text{+KHP}_2\text{O}_4$)を、錫酸化物層はPH2.8の10⁻³M HBr(N₂飽和)を電解液として用い、定電位および定電流法によって、T値¹⁾および錫酸化物量を測定した。定電位法の電位走査速度は100mv/min、定電流法の電流密度は78μA/cmである。
- (5)クロム付着量の測定：ブリキ表面のクロム層が熱濃アルカリ(7.5N-NaOH, 90°C)水溶液中で溶解挙動が異なる点に着目し、溶性クロム、難溶性クロム、不溶性クロムに分類し、蛍光X線分析した。

III 結果および考察

III-1. 塗料密着性の評価方法の検討

ブリキの塗料密着性はクロスカット試験あるいはゴバン目試験によって評価されている²⁾が、接着テープの粘着力および剥離方法によって評価が異なり、再現性に問題があった。そこで引張試験機を使用して塗膜の剥離強度を測定した。その結果を図1に示す。図1のテープ剥離試験の評価は密着力の比較的良好な塗料(SJ-6256)と密着力の比較的弱い塗料E(エポキシフェノール系)を用いたクロスカット試験の評価点であり、剥離強度はSJ-6256を用いたTピール試験の強度である。剥離強度が約0.5kg/5mmのブリキは、塗料SJ-6256を用いたテープ剥離によって一部に剥離が認められ、一方剥離強度が約2.0kg/5mmのブリキは、SJ-6256を用いたテープ剥離では剥離しない。

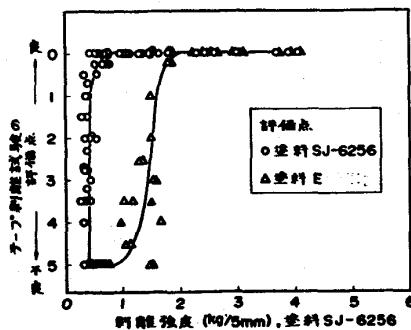


図1. テープ剥離試験（クロスカット試験）とTピール試験との比較

が、塗料Ⅳを用いると一部に剥離が認められる。さらに、これらの塗料で共通していることは、テープ剥離試験の評価点が異なっても、剥離強度はほとんど変化していないことである。したがって、テープ剥離試験よりTピール試験によって剥離強度を測定する方が広範囲の密着力を定量的に測定することができる。ただし板厚による効果が認められるので、さらに検討を要する。

III-2. 塗料密着性におよぼす諸因子の検討

A法およびB法のクロメート処理電気量と剥離強度の関係を図2に示す。図から(i) A法とB法では電気量 1.0 C/dm^2 以上で製造後の剥離強度に差がある。(ii) A法の電気量の小さい条件で処理したプリキは製造直後の剥離強度は強いが、貯蔵すると著しく弱くなる。(iii) B法の電気量 0.5 C/dm^2 以下で処理したプリキは製造直後の剥離強度も強く、貯蔵するとさらに強くなる。一方 1.0 C/dm^2 以上で処理したプリキは製造直後の剥離強度は弱いが、貯蔵しても変化が認められない。以上3点の現象が認められ、これらの現象を解明するために以下の検討を行なった。

(1) 錫酸化物層の影響

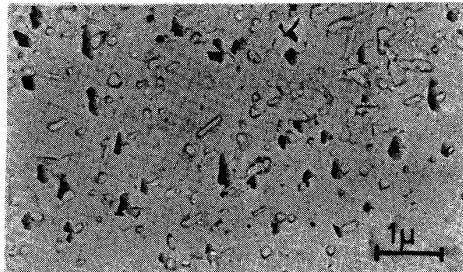


写真1. 斜方晶SnOの電子顕微鏡写真

表1. 斜方晶SnOの電子線回折結果

斜方晶SnO(3T2)	斜方晶SnO(002)		斜方晶SnO(247)	
	実測値 d(A) (hkl)	A.S.T.Mデータ d(A) (hkl)	実測値 d(A) (hkl)	A.S.T.Mデータ d(A) (hkl)
① 3.680(111)	3.58 (111)	3.719(010)	3.720(010)	3.760(102)
② 3.251(112)	3.12 (112)	4.868(100)	3.00 (100)	3.008(112)
③ 2.734(021)	2.786(021)	3.729(110)	3.776(110)	2.362(210)
④ 1.840(222)	1.79 (222)	2.860(020)	2.860(020)	1.880(204)
⑤ 1.734(130)	1.773(130)	2.434(200)	2.50 (200)	1.602(312)
⑥ 1.625(224)	1.56 (224)	2.434(120)	2.483(120)	1.540(312)
⑦ 1.610(133)	1.610(133)	2.230(210)	2.290(210)	
⑧ 1.429(042)	1.393(042)	1.864(220)	1.888(220)	
⑨		1.775(130)	1.773(130)	
回折パターン				

* A.S.T.Mデータを指数計算して求めた
** A.S.T.Mデータを指数計算して求めた

塗装前

(a) 剥離後



塗装前

(b) 剥離後



塗装前

(c) 剥離後



写真2. 塗装前と塗膜剥離後の錫酸化物の電子顕微鏡写真 (a) 斜方晶SnO (b) α-SnO (c) SnO₂

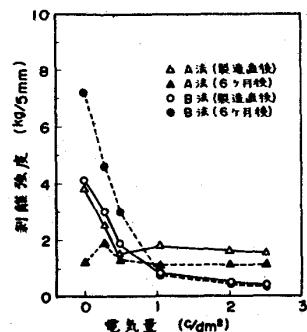


図2. 製造直後と貯蔵後の剥離強度と処理電気量の関係

プリキ表面に斜方晶SnO, α -SnO, SnO_2 を生長させ、塗装後Tピール試験によって剥離し、剥離界面と剥離強度を調査した。斜方晶SnOがプリキ表面に存在しているという報告はなかったが溶融処理したプリキを空焼(200°C 5時間)するか、室温で放置(8ヶ月)し錫酸化物を生長させた後3%NaHCO₃水溶液中で陰極還元(5A/dm² 1秒)を行なうと、プリキ表面に斜方晶SnOの存在が確認された。写真1. 表1.は斜方晶SnOの電子顕微鏡写真と電子線回折結果である。

写真2.はクロメート処理を施していないプリキ表面の塗装前と塗膜剥離後の各錫酸化物の電子顕微鏡写真である。斜方晶SnOは鱗片状、 α -SnOは花弁状(針状も存在)、 SnO_2 は粒状に観察される。斜方晶SnOと α -SnOは塗膜剥離後のプリキ表面に一部残っており、錫酸化物の内部での剥離と錫との界面での剥離が考えられる。 SnO_2 はプリキ表面から消失しており、 SnO_2/Sn の界面で剥離しているものと考えられる。それぞれのプリキの剥離強度は(a)のプリキが3~4 kg/5mm、(b)のプリキが約2 kg/5mm、(c)のプリキが0.5 kg/5mmであった。これらのプリキの錫酸化物量は塗装前の測定値で約350mc/dm²であった。

(2) 金属クロム層の影響

図3はC法によってブリキ表面に金属クロムを析出させた時の、金属クロム量と剥離強度の関係である。金属クロムが $0.7 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ 以上析出すると、剥離強度は $4 \sim 5 \text{ kg}/5\text{mm}$ でほぼ一定となる。剥離後ブリキ表面のクロム量を測定すると、熱濃アルカリに不溶なクロムでありしかも塗装前の金属クロム量に等しく、剥離は金属クロム/クロム酸化物の界面で生じているものと考えられる。写真3はC法で処理したブリキの電子顕微鏡写真を示す。

通常のクロメート処理したブリキに金属クロムが存在するか否かについては現在論議されているが、微量の金属クロムの存在が報告されている。⁸⁾著者らは通常のブリキ表面に金属クロムが存在する点について直接確認していないが、熱濃アルカリに1時間浸漬してもなお不溶なクロムが約 $0.05 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ 存在しており、C法で処理したブリキの金属クロム量も熱アルカリに対して不溶であることからこのクロムを金属クロムと考えた。

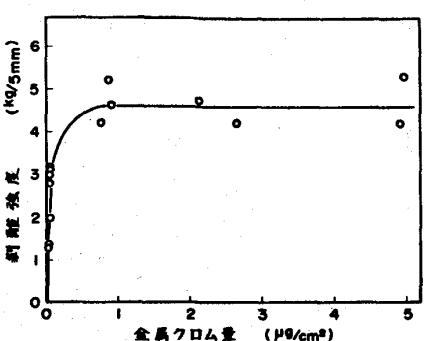


図3. 剥離強度におよぼす金属クロム量の影響

(a) Cr量 $2.7 \mu\text{g}/\text{cm}^2$

(b) 斜方晶 SnO

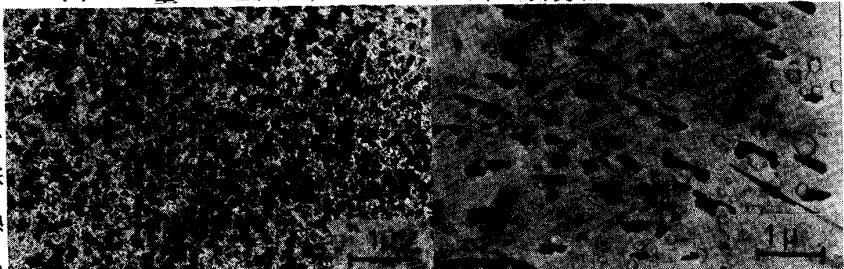


写真3. C法で処理したブリキ表面の電子顕微鏡写真

V.Leroy⁸⁾によると通常のクロメート処理したブリキの金属クロム量は、皮膜全体の3~10%であり、著者らが求めたクロム量にはほぼ等しい。金属クロム量の $0.05 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ は厚さに換算すると約 0.7 Å （金属クロムの比重、 $7.8/\text{cm}^3$ ）に相当し、原子半径 1.25 Å であることから均一な皮膜とは考えられない。おそらくブリキ表面に点在しているのであり、剥離強度に対しての影響は無視できるものと考えられる。図3で金属クロムの少ないブリキの剥離強度が約 $3 \text{ kg}/5\text{mm}$ であるのは表面に斜方晶 SnO が存在していたためであろう。

(3) クロメート処理皮膜の影響

図4に剥離強度とクロム量、錫酸化物量、T値の関係を示す。T値はクロムの組成を示す尺度として既に報告したが、¹⁾陽極分極曲線（図5.）、クロム量の測定から難溶性クロムの量および密さを示しているものと考えられる。難溶性クロムの組成は明らかでないが、熱濃アルカリに溶けにくくことから考えて、無水のクロム酸化物に近い組成であろう。図4のI、II、IIIはクロムおよび錫酸化物の組成を分類したものであり、Iは溶性クロムと斜方晶 SnO を主体としたブリキであり、IIは溶性クロムと3種類の錫酸化物が混合したブリキであり、IIIは難溶性クロムを主体としたブリキである。IIIに属するブリキは貯蔵しても錫酸化物の成長はほとんど認められず、耐硫化黒変性にも優れることなどから、難溶性クロムが錫層を均一に覆っているものと考えられる。しかし塗膜の剥離強度は弱く約 $0.5 \text{ kg}/5\text{mm}$ である。

ここでT値と剥離強度の関係を図6の模式図によって考察を行なう。クロメート処理を施していないブリキあるいはクロメート処理を施してもT値の少ないブリキの剥離強度は、錫酸化物の種類によって影響され、実線(1)(2)(3)の強度となる。一方T値の多いブリキの剥離強度は、難溶性クロムと錫層の密着力であり実線(4)である。金属クロムが析出し錫層を覆うと、剥離強度は金属クロムとクロム酸化物の密着力に依存し実線(5)となる。ブリキの塗装密着性はこれらの層の存在割合によって決定されており、T値の少ないブリキは破線(1)~(3)間の剥離強度を示し、T値が多くなると実線(4)さらに破線(5)となる。

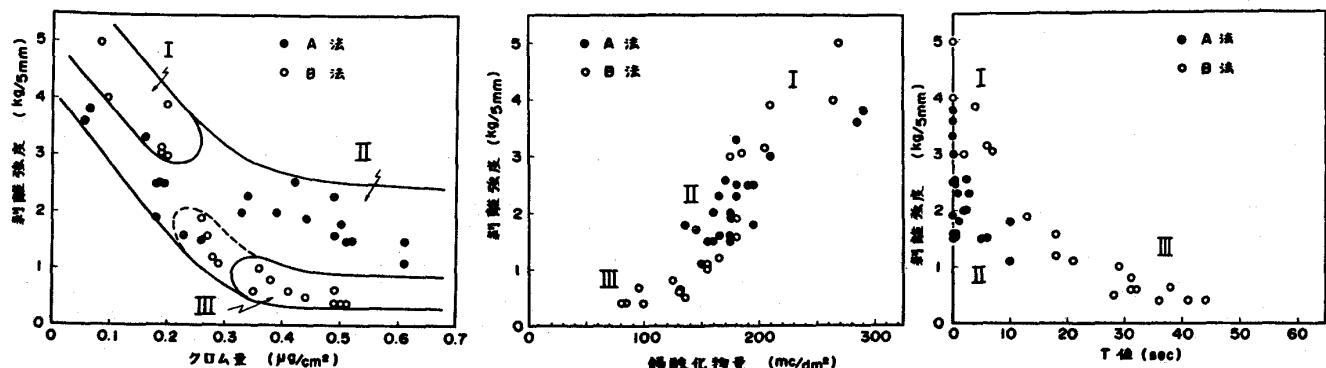


図4. 剥離強度とクロム量、錫酸化物量、T値の関係

(4) 経時による影響

A法、B法、C法で処理したブリキを室温および50℃相対湿度95%の雰囲気中で貯蔵した際の、錫酸化物量と剥離強度の関係を図7に示す。貯蔵後は同じ錫酸化物量で剥離強度に差があり、350 mc/dm²のときA法での浸漬処理が約2 kg/5mmに対して、B法での浸漬処理は約7 kg/5mmであった。これは錫酸化物の組成の違いである。6ヶ月貯蔵したブリキを200℃で空焼すると、前者のブリキは斜方晶SnO、α-SnO、SnO₂が混在しており、後者のブリキは斜方晶SnOのみであった。前者のブリキが6ヶ月後に著しく劣化するのは、特にSnO₂が成長したためである。後者のブリキはNaHCO₃水溶液中でα-SnOとSnO₂の核が還元除去されているため、斜方晶SnOのみが成長し、剥離強度が増加したものと考えられる。B法の2.5 c/dm²で処理したブリキあるいはC法で処理したブリキは、難溶性クロムあるいは金属クロムによって錫酸化物の成長が防止されているため、経時による影響は受けないので、製造直後の密着性を維持している。

IV. 結 言

ブリキの塗料密着性について、不働態皮膜の組成から検討を加えた結果、斜方晶SnOが存在し、難溶性クロムを含まないブリキは長期にわたって安定した塗料密着性を維持することがわかった。

参考文献

- (1) 高野宏、渡辺豊文、金属表面技術協会第54回講演会前刷、114(1976)
- (2) 東洋鋼板：ぶりきとティンフリースチール、1974 [アグネ]
- (3) V. Leroy, J. P. Servais, L. Habraken, First International Tinplate Conference, 1976

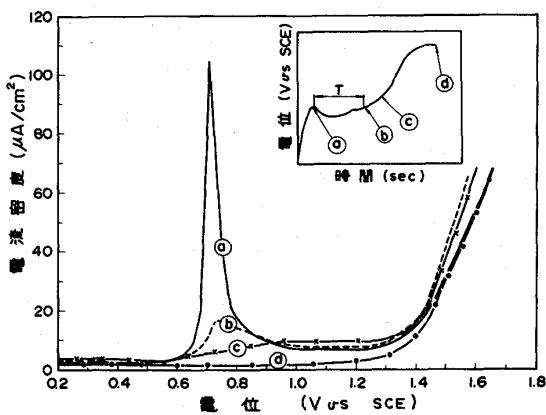


図5. ブリキの陽極分極曲線

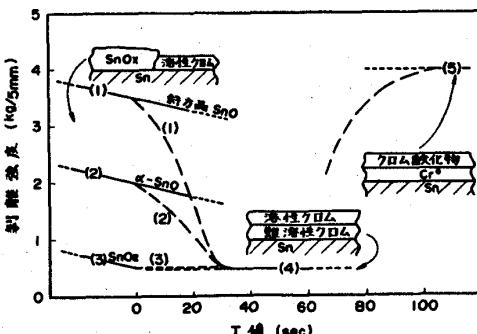


図6. 剥離強度とT値および模式図の関係

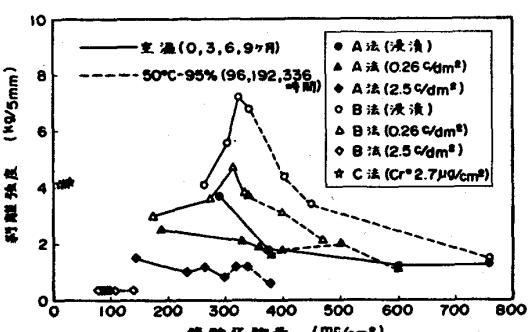


図7. 剥離強度と貯蔵後の錫酸化物の関係